
編集後記

JSA の 23 巻 2 号をお届けします。

技術記事では、古川さんの XPS ピーク検出アルゴリズムの検証、永富さんの深さ方向分析のアンケート結果のまとめを掲載しました。また、巻頭言を青柳先生に、JASIS コンファレンスの Q&A の報告を永富会長に寄稿いただきました。

世の中は激動の時代を迎えているように思います。

2016 年は、政治的な大きな変化を象徴する出来事が起こり、また、Industry 4.0, IoT など、技術の隅々まで影響が及ぶ変化が姿を見せ始めています。変化の波に掉さすのも正体を見極めるのも、業種業態を超えた情報交換がキーになります。表面分析技術の向上を目指す SASJ への積極的な参加と、本誌への投稿をあわせてお願いします。(眞田)

JSA Journal of Surface Analysis

JSA 編集委員会 jsa@sasj.jp 電話:0467-85-4220 / Tel: +81-467-85-4220

編集委員長：眞田 則明 (アルバック・ファイ)

編集理事：佐藤 美知子 (富士通クオリティ・ラボ)

編集委員：阿部 芳巳 (MCHC R&D シナジーセンター), 伊藤 博人 (コニカミノルタ),
井上 雅彦 (摂南大学), 大友 晋哉 (古河電気工業),
大村 和世 (東北大学), 木村 昌弘 (JX 金属),
熊谷 和博 (産業技術総合研究所), 鈴木 峰晴 (筑波大学),
田沼 繁夫 (物質・材料研究機構), 當麻 肇 (日産アーク),
永富 隆清 (旭化成), 橋本 哲 (JFE テクノリサーチ),
吉川 英樹 (物質・材料研究機構), 吉原 一紘 (シエンタ オミクロン)

SASJ: International Advisory Board

J. T. Grant (University of Dayton, USA)

H. J. Kang (Chungbuk National University, Korea)

S. Hofmann (Max-Planck-Institute for Metals Research, Germany)

A. Jablonski (Institute of Physical Chemistry, Poland)

C. J. Powell (National Institute of Standards and Technology, USA)

M. P. Seah (National Physical Laboratory, UK)

Y. C. Ling (National Tsing Hua University, Taiwan)

Journal of Surface Analysis Vol. 23, No.1

編集・発行：一般社団法人表面分析研究会

<http://www.sasj.jp/>

2016 年 12 月 26 日 印刷

2016 年 12 月 28 日 発行

発行所：〒108-0074 東京都港区高輪 3-6-7

一般社団法人表面分析研究会

電話：03-3473-6878 FAX：03-3473-6862

Printed: December 26, 2016

Published: December 28, 2016

Published by

The Surface Analysis Society of Japan

Takanawa 3-6-7, Minato-ku, Tokyo 108-0074

Tel: +81-3-3473-6878 Fax: +81-3-3473-6862